

## 分析機器部門講習会シリーズ

### 集束イオンビーム走査電子顕微鏡(FIB/SEM) 講演会のお知らせ

FIB/SEMを使用した生物系試料の連続断面観察の第一人者でもある久留米大学 医学部 解剖学講座 太田啓介先生による講演会を開催いたします。

日時：平成27年 3月11日(水) 17:00~18:00

講師：久留米大学 医学部 解剖学講座 太田啓介 准教授

題目： FIB/SEMトモグラフィーによる生体メゾスケール構造の三次元解析法

講演内容：最先端のFIB/SEMを使用した実践的な話から生物系試料の微細な三次元構築の可能性まで

場所：実習室402 (研究棟3号館 4階 分析機器部門)

定員：約20名

申込期間：平成 27年 3月 10日 (火) 12時まで

申込方法：電子メールで、「講演会名 (FIB/SEM講演会)」「所属講座名」「氏名」「内線番号」「電子メールアドレス」を明記の上、  
k.itakura@med.nagoya-u.ac.jp 宛にお申込ください。

#### お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当：板倉 (内線：5792 Email：k.itakura@med.nagoya-u.ac.jp)

※Web でも講習会情報を掲載しています (<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>)